

## 平成 26 年度 国立大学法人名古屋工業大学設備サポート講習会参加者募集のお知らせ

名古屋工業大学の大型設備基盤センターの設備を活用して下記のように講習会を開催します。本講習会は、各種の機器・分析装置に関する新たな知識や技術の取得を目指す技術職員および教員を対象としています。コース・テーマ・概要は以下の通りですが、少人数体制で行いますので、ご要望があれば可能な限り対応させていただきます。また講習会を通じて、参加者と講習会担当者との技術交流を深めていくことも目的のひとつです。この機会にぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。

### 1 コース・テーマ・概要

#### Aコース「有機化合物の構造解析」

未知の有機化合物について、NMR・元素分析・MSの測定を行い、それらのデータをもとに化合物の構造を決定する。また、構造を解析するために必要な、基本的なデータ解析についても理解する。

注) NMR を使用するため、ペースメーカー使用者は受講不可

#### Bコース「X線光電子分光法による深さ方向分析と帯電補正の試み」

Ar イオンスパッタリングによるシリコン酸化膜の深さ方向分析を行い、エッチングレイトを求める。絶縁体試料を用いチャージアップ(帯電)状態の測定結果と帯電補正した測定結果を比較する。

#### Cコース「AESによるIC断面の分析」

CP (Cross-section Polisher) で研磨したIC (集積回路) の切断表面について、AESによる分析を行う。

#### Dコース「FIBを用いたTEM観察試料の作製」

FIB を使用しバルク状の試料から薄片を切り出した後、ピックアップシステムにて試料片を取り出しTEM 観察を行う一連の作業の研修を行う。

### 2 開催期間・日程

それぞれのコースについて、受講申込受付後、各コース担当者から受講を希望される方へ連絡し、7月～10月の間で日程・カリキュラムを調整します。

### 3 会場

#### (1)A～Cコース

国立大学法人名古屋工業大学大型設備基盤センター (名古屋市昭和区御器所町)

#### (2)Dコース

国立大学法人名古屋工業大学先進セラミックス研究センター (岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6-29)

### 4 受講資格

国立大学法人等に勤務し機器・分析装置を取り扱っている、もしくはこれから取り扱う予定の教員、職員の方で、機器・分析装置について専門的知識・技術等を修得したい方。

### 5 募集定員

各コースそれぞれ若干名

### 6 受講料

(1)講習に直接要する経費は、国立大学法人名古屋工業大学が負担します(無料)。

(2)会場までの旅費・宿泊費は、受講者の所属する機関でご負担ください。

(3)昼休みを挟む場合には、昼食は各自でご用意ください。

### 7 申込期間

平成 26 年 7 月 15 日(火)～10 月 1 日(水)

### 8 申込方法およびお問い合わせ先

下記まで電話もしくは電子メールでお申し込みください。

国立大学法人名古屋工業大学技術部 担当：玉岡 悟司 TEL (052)735-5313 tamaoka@nitech.ac.jp